

Diplomová práce



České
vysoké
učení technické
v Praze

F3

Fakulta elektrotechnická
Katedra mikroelektroniky

Reflektometr v časové oblasti

Bc. Petr Polášek

Vedoucí: Ing. Viktor Adler, Ph.D.

Obor: Elektronika a komunikace

Studijní program: Elektronika

Listopad 2019

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Polášek** Jméno: **Petr** Osobní číslo: **435028**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávací katedra/ústav: **Katedra mikroelektroniky**
Studijní program: **Elektronika a komunikace**
Studijní obor: **Elektronika**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Reflektometr v časové oblasti

Název diplomové práce anglicky:

Time-Domain Reflectometer

Pokyny pro vypracování:

Prostudujte problematiku časové reflektometrie a navrhnete schéma zapojení a zkonstruuje samostatně fungující měřicí zařízení pracující na principu časové reflektometrie (TDR, Time-Domain Reflectometry) a využijte techniku vzorkování v ekvivalentním čase. Jako budící signál měřeného obvodu použijte obdélníkový signál, u něhož se snažte dosáhnout co nejkratší náběžné hrany. Implementujte zpracování změřených vzorků tak, aby se dala určit poloha a typ diskontinuity na měřeném vedení. Dále implementujte kalibrační metodu využívající předem známé vlastnosti vhodných mechanických kalibrů.

Konzultant: prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc.

Seznam doporučené literatury:

Ndagijimana Fabien, Signal Integrity: From High-Speed to Radiofrequency Applications, J.Wiley & Sons, New York, 2014
Cataldo Andrea, De Benedetto Egidio, Cannazza Giuseppe, Broadband Reflectometry for Enhanced Diagnostics and Monitoring Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011
Fabien Ndagijimana, Signal Integrity: From High-speed to Radiofrequency Applications, J. Wiley&Sons, New York, 2014

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

Ing. Viktor Adler, Ph.D., katedra elektromagnetického pole FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:

Datum zadání diplomové práce: **04.10.2019**

Termín odevzdání diplomové práce: _____

Platnost zadání diplomové práce: **30.09.2021**

Ing. Viktor Adler, Ph.D.
podpis vedoucí(ho) práce

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
podpis děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomant bere na vědomí, že je povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

Datum převzetí zadání

Podpis studenta

Poděkování

Děkuji svým rodičům i celé rodině, že mi byli oporou po celou dobu mého studia.

Děkuji Ing. Viktoru Adlerovi, PhD. a prof. Ing. Karlu Hoffmannovi, CSc. za umožnění přístupu k mikrovlnné měřicí technice a možnost konzultování detailů této práce.

Děkuji Ing. Viktoru Adlerovi za významnou pomoc při analýze vysokofrekvenčních parametrů substrátu použitého pro plošný spoj reflektometru.

Děkuji také studentskému klubu Silicon Hill a projektu „MacGyver - Bastlíři SH“ za umožnění přístupu k měřicímu vybavení.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem č. 1/2009 o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

Dále prohlašuji, že nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu §60 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

V Praze, 9. listopadu 2019

.....
Bc. Petr Polášek

Abstrakt

Tato práce se zabývá konstrukcí reflektometru v časové doméně, výsledkem je funkční zařízení s ovládacím softwarem. Cílem bylo vyvinout zařízení pro měření odrazů na vedení schopné detekce závad na vedení s přesností detekce polohy závady v řádu jednotek centimetrů. Důraz byl kladen na co nejmenší cenu výsledného zařízení a zároveň co nejjednodušší konstrukci, ovšem se snahou, aby tato kritéria neomezovala použitelnost či funkčnost zařízení.

Výsledné zařízení dokáže měřit ve frekvenčním rozsahu do řádu jednotek GHz, vzorkovací krok měření je 20 ps, ekvivalentní vzorkovací kmitočet je tedy 50 GSa.s^{-1} . Tento vzorkovací krok teoreticky umožňuje rozlišovací schopnost polohy závady na vedení 0,3 cm ve vakuu, v reálném prostředí může být i lepší. Samostatně dokáže zařízení detekovat jednoduché závady, jejich typ a polohu. V součinnosti s počítačem je možné provést i kalibraci pomocí kalibrační sady pro korekci nedokonalostí zařízení.

V práci je popsána vytvořená konstrukce reflektometru a princip jeho funkce. Jednotlivé funkční bloky jsou podrobně popsány, vysvětlen je i postup optimalizace těchto bloků k dosažení co nejlepších parametrů zapojení. Vysvětleny jsou i metody detekce závad na vedení, kalibrace zařízení a autokalibrace.

Práce se zabývá i případnými možnostmi, jak by bylo možné rozšířit schopnosti tohoto zařízení o funkci transmisometru, která by umožnila používat toto zařízení jako vektorový analyzátor v časové oblasti.

Klíčová slova: reflektometrie, reflektometr, TDR

Vedoucí: Ing. Viktor Adler, Ph.D.

Abstract

This work deals with construction of reflectometer in time domain, which is implemented as functional device along with control software. The goal was to develop a device capable of measuring reflections on transmission lines caused by faults with spatial resolution on the order of units of centimetres. The emphasis was to develop a cheap and simple device while trying not to limit the functionality or capability of the device.

The resulting device is able to measure up to units of GHz, sampling step is 20 ps, resulting in equivalent sampling rate of 50 GSa.s^{-1} . This sampling step theoretically allows spatial resolution of 0.3 cm in vacuum, possibly even less in real environment. The device can detect simple faults on its own, along with their type and position. When used with computer, it is possible to perform calibration using calibration set.

The work contains explanation of the construction and its principles. Each functional block is described in detail as well as the optimisations which were used to obtain the best possible parameters of the construction. Also explained are methods of detection of faults on the transmission line, calibration and autocalibration of the device.

This work also deals with eventual possibilities of extending the capabilities of the device by implementing a function of transmissometer, which could allow to use the device as a vector network analyzer in time domain.

Keywords: reflectometer, reflectometry, TDR

Title translation: Time-Domain Reflectometer

Obsah

Seznam zkratk použitých v textu	1		
1 Zadání a vlastní cíle návrhu	3		
1.1 Zadání	3		
1.2 Vlastní cíle návrhu	3		
2 Princip měření	5		
2.1 Základní princip měření	5		
2.2 Měření v ekvivalentním čase	6		
2.3 Interpretace měřených výsledků	6		
3 Princip zapojení	7		
3.1 Základní princip zapojení	7		
3.2 Blokové zapojení	7		
3.3 Generování potřebných hodinových signálů	7		
3.4 Tvorba budicího pulzu	11		
3.5 Přizpůsobovací obvody a testovací port	13		
3.6 Vzorkovací obvody	15		
3.7 Oddělovací zesilovač	15		
3.8 Sekundární vzorkování	15		
3.9 Digitalizace měřeného průběhu	15		
4 Kalibrace	17		
4.1 Chybový model	17		
4.2 Chyby pramenící z nepřesnosti frekvence fázového závěsu	17		
4.3 Měření parametrů chybového modelu	17		
4.4 Kompenzace chyb	17		
4.5 Omezení plynoucí z omezené šířky pásma zapojení	17		
5 Detekce závad	19		
5.1 Princip hledání závad	19		
5.2 Základní typy závad	19		
5.3 Složené závady	19		
5.4 Výpočet impedančního profilu	19		
6 Změřené parametry	21		
6.1 Budicí pulz	21		
6.1.1 Průběh budicího pulzu	21		
6.1.2 Spektrum budicího pulzu	21		
6.2 Parametry fázového závěsu	21		
6.2.1 Jitter fázového závěsu v celočíselném režimu	21		
6.2.2 Jitter fázového závěsu v racionálním režimu	21		
6.2.3 Drift fázového závěsu	21		
7 Uživatelské rozhraní a popis ovládání	23		
7.1 Chování zařízení v autonomním režimu	24		
7.1.1 Autokalibrace	24		
7.1.2 Kalibrace pomocí kalibračních standardů	24		
7.1.3 Měření	24		
7.1.4 Vyhodnocení změřených dat	24		
7.2 Chování zařízení v režimu s připojeným počítačem	24		
7.2.1 Autokalibrace	24		
7.2.2 Kalibrace pomocí kalibračních standardů	24		
7.2.3 Měření	24		
7.2.4 Vyhodnocení změřených dat	24		
8 Závěr	25		
A Literatura	27		

Obrázky

3.1 Blokové zapojení reflektometru...	8
3.2 Vnitřní blokové zapojení obvodu Si5351, převzato z [Sil18].....	8
3.3 Zapojení hodinového generátoru Si5351.	11
3.4 Zapojení generátoru budících pulzů.....	12
3.5 Schéma přizpůsobovacích obvodů.	13
3.6 Schéma použité pro simulaci v programu LTSpice.....	14
3.7 Vstupní impedance reflektometru.	14
3.8 Přizpůsobení vstupní impedance reflektometru.	15



Seznam zkratek použitých v textu

- ADC** Analog-Digital Converter. 9
- CML** Current Mode Logic. 10, 11
- CMOS** Complementary Metal Oxide Semiconductor. 10
- DDS** Direct Digital Synthesis. 10
- ECL** Emitter Coupled Logic. 10
- FPGA** Field Programmable Gate Array. 10
- LVDS** Low Voltage Differential Signaling. 10
- TCXO** Temperature Compensated Crystal Oscillator. 10
- TTL** Transistor-Transistor Logic. 10
- USB** Universal Serial Bus. 4
- VCO** Voltage Controlled Oscillator. 7, 10

Kapitola 1

Zadání a vlastní cíle návrhu

1.1 Zadání

Zadání této práce je vytvořit samostatně funkční reflektometr v časové oblasti na principu vzorkování v ekvivalentním čase. Budicí signál by měl být obdélníkového tvaru s co nejkratší náběžnou (či sestupnou) hranou. Zařízení by mělo být schopné samostatné funkce a mělo by být schopné určit polohu a typ základních typů diskontinuit na vedení. Mělo by být též možné provést kalibraci zařízení pomocí mechanických kalibrů.

1.2 Vlastní cíle návrhu

Mimo již zmíněných cílů, které vycházejí ze zadání práce, vznikly další cíle, jejichž dosažení není zadáním nijak vyžadováno, ale které si autor stanovil jako svoje vlastní cíle, kterých by chtěl v rámci této práce dosáhnout. Jejich hlavním společným faktorem je požadavek na minimalismus celé konstrukce, jak z pohledu složitosti zapojení, tak i jeho velikosti a konečně také ceny. Zařízení by mělo být opakovatelně výrobitelné, poud možno i v amatérských podmínkách. Podmínkou pro dodržení těchto cílů je však to, aby jejich splnění nedegradovalo kvalitu výsledného zařízení na mez použitelnosti.

- **Jednoduchost zapojení.** Konstrukce by měla být co nejjednodušší a obsahovat co nejméně komponent, aby měla co nejméně stupňů volnosti a bylo ji možné optimalizovat již ve fázi návrhu pomocí simulací a výpočtů. Tím se zmenšuje počet nezbytných cyklů návrhu, výroby a měření, které je nezbytné projít, aby zařízení splňovalo očekávané vlastnosti.
- **Použití pouze běžně dostupných a nahraditelných komponent.** Konstrukce by neměla obsahovat žádné komponenty, které jsou nenahraditelné. Jejich nedostupnost na trhu by pak znamenala, že zařízení již není možné vyrobit. V horším případě by se celá architektura zapojení

musela přepracovat. Použité komponenty by navíc měly být pokud možno běžně dostupné - konstrukce by se měla pokud možno vyhnout například zákaznickým obvodům nebo na míru vyrobeným polovodičovým součástkám.

- **Použití pouze běžných konstrukčních metod.** Konstrukce by se měla vyhnout výrobním postupům, které se používají pouze u specializovaných zařízení a které není možné snadno replikovat. Tím jsou myšleny například polovodičové prvky pájené přímo substrátem na plošný spoj a následně strojově bondované.
- **Použití pouze technologií nevyžadujících speciální provozní podmínky.** Zařízení by mělo být pokud možno minimálně závislé na podmínkách okolního prostředí. Neměly by být použity například technologie vyžadující kryogenické chlazení, udržování konstantní teploty, speciální atmosféry nebo dokonalé stínění před světlem.
- **Žádné manuálně nastavované prvky při výrobě.** Konstrukce by neměla obsahovat žádné nastavitelné prvky, které by se musely po vyrobení prvotně nastavit. Všechny takové prvky by měly být řízené elektronicky a nastavované v rámci autokalibrace zařízení.
- **Jednoduchost ovládání.** Zařízení by mělo uživatele celým procesem autokalibrace a měření co nejjednodušeji provést. Zařízení by mělo samo nalézt možné závady na vedení a oznámit jejich typ a polohu.
- **Komunikace s počítačem.** Zařízení by mělo být schopné komunikovat s počítačem přes rozhraní Universal Serial Bus (USB) a umožnit uložení změřených dat, rozšířené ovládání a případně složitější metody kalibrace.

Kapitola 2

Princip měření

2.1 Základní princip měření

Reflektometrie v časové oblasti (dále již jen reflektometrie) v kontextu této práce znamená měření vlastností jednobranu, které probíhá na základě měření odezvy měřeného systému na budicí signál, přičemž toto měření probíhá v časové oblasti. Pro měření je možné použít jako budicí signál libovolný kauzální signál, typicky se však využívají pouze průběhy podobné pravoúhlému průběhu nebo jednotkovému v případě širokopásmových reflektometrů. Vzhledem k tomu, že není možné je fyzicky realizovat, protože by vyžadovaly nekonečnou šířku pásma generátoru pulzů, používají se podobné signály, například chybová funkce [Tek85] nebo Gaussův pulz [GLR07]. V případě úzkopásmových reflektometrů se používá například sinusový průběh modulovaný Gaussovým pulzem [MP74]. Pro diagnostiku vedení, která jsou v době měření používána pro komunikaci, se používá například pseudonáhodný průběh [CF05].

Za předpokladu lineárního invariantního systému a kauzálního budicího signálu je možné závislost odezvy měřeného systému na budicím signálu zapsat následujícím způsobem [Sar97], kde $x(t)$ je budicí signál, $y(t)$ je změřená odezva systému na daný budicí signál a $h(t)$ je impulzní odezva:

$$y(t) = x(t) * h(t). \quad (2.1)$$

Při měření reflektometrem je cílem získat tuto impulzní odezvu, případně skokovou odezvu. Tu je možné buď přímo použít k hrubé analýze měřeného systému nebo provést kalibrační měření, kterým je možné odstranit některé chyby měření, a měřený systém analyzovat výrazně přesněji. Na digitální reflektometry je možné ve frekvenční oblasti aplikovat podobné korekční algoritmy, jako na vektorové analyzátoři.

V případě odstranění systémových chyb měření je možné provádět složitější analýzy měřeného systému, např. vypočítat impedanční profil měřeného vedení nebo použít reflektometr podobně jako jednoportový vektorový analyzátor.

2.2 Měření v ekvivalentním čase

Pro vysokorychlostní měření se používají dvě metody měření, měření v reálném čase a měření v ekvivalentním čase.

Měření v reálném čase zpravidla probíhá tak, že jsou všechna měřená data získána z jediné realizace měřeného průběhu. Toto měření je spuštěno předem definovanou spouštěcí událostí, načež je velice rychle změřeno velké množství vzorků. Výhodou tohoto typu měření je možnost změřit jednorázové jevy. Nevýhodou je omezený vzorkovací kmitočet, který se v současné době pohybuje v jednotkách GSa.s^{-1} . Dále je nevýhodou nezbytnost velice rychle zpracovávat velké množství dat. Tato metoda měření vyžaduje využití velice rychlých digitálních obvodů. Dodnes se v reflektometrech běžně nevyužívá, neboť neumožňuje dostatečně vysoké vzorkovací kmitočty.

Měření v ekvivalentním čase naopak probíhá během většího množství realizací měřeného průběhu. Měření probíhá tak, že po každé spouštěcí události je odebrán určitý počet vzorků. Při další spouštěcí události dojde ke zhuštění naměřených dat. Ke změření celého průběhu je nezbytné, aby se měření opakovalo, dokud nejsou změřeny všechny body. Nevýhodou tohoto postupu je pomalejší měření a nemožnost změřit jednorázové jevy, nicméně pro statické úlohy, které jsou pro reflektometrická měření typická, je tato metoda vhodná. Tato metoda měření je téměř nezávislá na skutečném vzorkovacím kmitočtu, který pouze omezuje rychlost měření. Vzorkovací kmitočet je omezen pouze konstrukcí časovacích obvodů. Definuje se pak tzv. ekvivalentní vzorkovací kmitočet, který odpovídá převrácené hodnotě nejkratšího měřitelného časového kroku.

2.3 Interpretace měřených výsledků

Po změření odezvy systému na budicí pulz je výsledkem odezva, která je však zatížená chybami měření. Pro jejich odstranění je možné využít převedení změřeného průběhu do časové domény následně aplikaci korekčních algoritmů používaných typicky pro vektorové analyzátory. Je tak možné odstranit přeslechy, útlum vedení připojeného k reflektometru, odrazy na připojovacích konektorech a frekvenční charakteristiku samotného budicího pulzu. Po odstranění těchto systémových chyb je možné převést je zpět do časové oblasti. Výsledkem je zkalibrovaný průběh, ze kterého je již možné spočítat např. impedanční profil měřeného systému.

Kapitola 3

Princip zapojení

3.1 Základní princip zapojení

Zapojení se skládá z generátoru impulsů, vzorkovacích obvodů a řídicího fázového závěsu, který tyto dvě části synchronizuje. Generátor impulsů se používá pro tvorbu budicího signálu, který je zaveden do měřeného systému. Pomocí vzorkovacího můstku se pak provádí měření odezvy měřeného systému. Fázový závěs časuje spouštění generátoru a vzorkovače asynchronně tak, aby se postupně spouštěcí událost obou částí vzájemně posouvala. Tím dochází k tomu, že každý vzorek odpovídá jinému bodu měřené odezvy. Zařízení tedy pracuje v režimu měření v ekvivalentním čase. To znamená, že měřená odezva není změřena v reálném čase, ale je pomalu sbírána. V navrženém zapojení dojde při každé periodě budicího signálu ke změření jednoho vzorku odezvy systému.

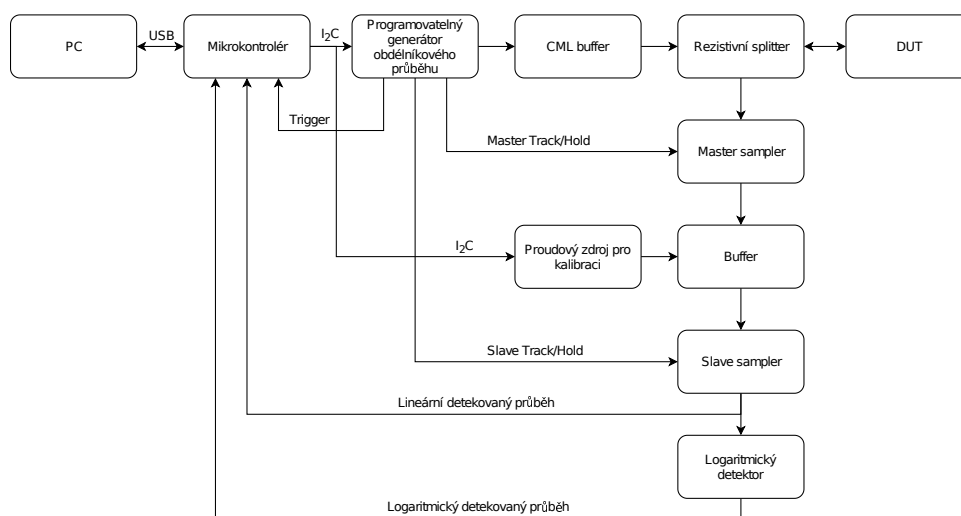
3.2 Blokové zapojení

Blokové zapojení reflektometru je znázorněno na obrázku 3.1. V dalších částech této kapitoly jsou jednotlivé bloky popsány do hloubky.

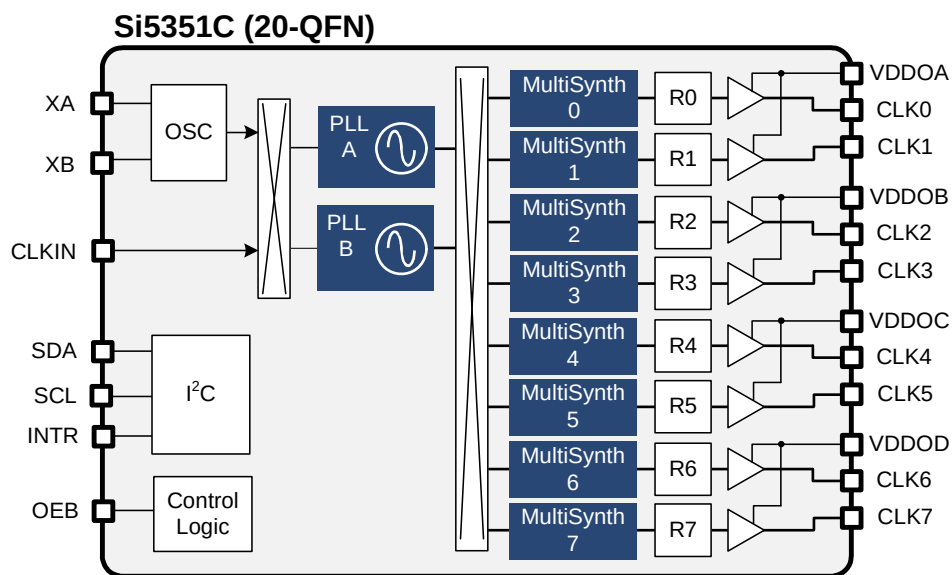
3.3 Generování potřebných hodinových signálů

Hlavním prvkem celého zapojení je vícekanálový digitální fázový závěs, který je postaven na obvodu Si5351C-B [Sil18]. Tento obvod obsahuje krystalový oscilátor, na nějž jsou zavěšeny dva interní oscilátory VCO. Vnitřní blokové schéma je možné vidět na obrázku 3.2.

Frekvenci těchto oscilátorů je možné nezávisle nastavit. Jejich frekvence f_{VCO} může být neceločíslným násobkem frekvence krystalového oscilátoru



Obrázek 3.1: Blokové zapojení reflektometru.



Obrázek 3.2: Vnitřní blokové zapojení obvodu Si5351, převzato z [Sil18].

f_{XTAL} .

$$f_{VCO} = f_{XTAL} \left(a + \frac{b}{c} \right) \quad (3.1)$$

Koeficient a může nabývat hodnot $\langle 15, 90 \rangle$. V neceločíselném režimu může koeficient c nabývat hodnot $\langle 0, 1048575 \rangle$, koeficient b pak $\langle 0, c \rangle$. Je tedy možné nastavit frekvenci oscilátorů tak, že se liší o méně než 1 ppm. Při použití těchto dvou frekvencí jako časovacích signálů pro buzení a vzorkování je tedy možné odebírat až 1048576 vzorků. Dochází totiž k tomu, že s každou periodou se postupně hrany těchto obdélníkových signálů vůči sobě časově posunou o fixní časový krok. Tento krok je možné spočítat z nastavených frekvencí oscilátorů.

$$\begin{aligned} f_{VCO1} &= f_{XTAL} \left(a_1 + \frac{b_1}{c_1} \right) \\ f_{VCO2} &= f_{XTAL} \left(a_2 + \frac{b_2}{c_2} \right) \end{aligned} \quad (3.2)$$

Za těmito oscilátory ještě následují děličky. Ty také umožňují neceločíselné dělení, které je ovšem nevýhodné, protože může zvyšovat fázové chvění výstupního signálu. Proto jsou použity pouze v celočíselném režimu. Děličky jsou použity kvůli omezenému vzorkovacímu kmitočtu použitého ADC. Výsledkem jsou tedy dvě frekvence f_{OUT1} a f_{OUT2} . Označíme-li společný dělicí poměr d a za předpokladu, že $a_1 = a_2 = a$, $c_1 = c_2 = c$ a $b_2 = 0$:

$$\begin{aligned} f_{OUT1} &= \frac{f_{VCO1}}{d} = f_{XTAL} \left(\frac{a + \frac{b_1}{c}}{d} \right) \\ f_{OUT2} &= \frac{f_{VCO2}}{d} = f_{XTAL} \left(\frac{a}{d} \right) \end{aligned} \quad (3.3)$$

Pak se během jedné periody oscilátory vůči sobě posunou o čas T_{SHIFT} :

$$\begin{aligned} T_{SHIFT} &= T_{OUT2} - T_{OUT1} = \frac{1}{f_{OUT2}} - \frac{1}{f_{OUT1}} \\ T_{SHIFT} &= \frac{d}{f_{XTAL}} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a + \frac{b_1}{c}} \right) = \frac{d}{f_{XTAL}} \left(\frac{1}{1 + a \frac{c}{b_1}} \right) \end{aligned} \quad (3.4)$$

Pro minimalizaci fázového chvění je podle [Sil18] a [Sil15] vhodné preferovat celočíselné násobení i dělení, je-li to možné. Dále může fázové chvění zmenšit i použití sudých násobitelů a dělitelů. V navrženém zapojení je tedy fázový závěs nastaven takto:

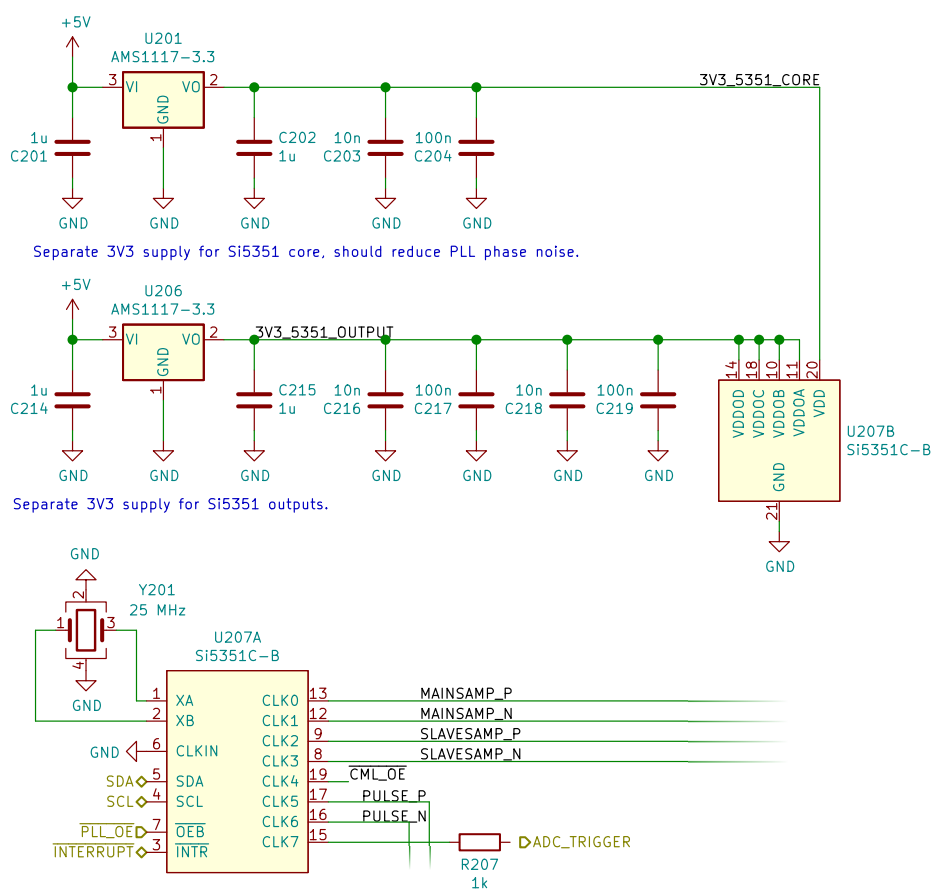
$$\begin{aligned}
f_{XTAL} &= 25\text{MHz} \\
a &= 24 \quad b_1 = 1 \\
c &= 500000 \quad d = 128 \cdot 46 \\
f_{OUT1} &\doteq 101902\text{kHz} \doteq f_{OUT2} \\
T_{SHIFT} &= \frac{46 \cdot 128}{25000000} \left(\frac{1}{1 + 24 \cdot \frac{500000}{1}} \right) \doteq 19.627\text{ps}
\end{aligned} \tag{3.5}$$

Podobný princip měření pomocí dvou oscilátorů o podobné frekvenci se již v literatuře objevil, avšak zatím nebyl implementován přímo pomocí fázového závěsu. V [DJJ03] byly použity dva nezávislé oscilátory. Toto řešení je sice jednodušší, avšak není možné zajistit, jak velký bude časový krok měření. Vzhledem ke skutečnosti, že oscilátory jsou závislé na teplotě a dalších vnějších vlivech, není možné zajistit ani dlouhodobou stabilitu. Při použití dvojitého fázového závěsu s neceločíselným násobitelem však je možné tuto dlouhodobou stabilitu zajistit. Krok měření je pak závislý pouze na frekvenci jediného krystalového oscilátoru. Při použití TCXO může být tato stabilita velmi dobrá, na úrovni jednotek ppm.

Další podobný způsob časování vzorkování je použit v [TKF⁺13], kde je využito FPGA jako DDS. Výstup z této DDS je filtrován dolní propustí a následně zaveden do komparátoru, čímž je získáván obdélníkový řídicí signál. Řízení vzájemné polohy budicího pulzu a vzorkování je pak dosaženo nastavováním fáze sinusového signálu, který je generován DDS. Tento systém umožňuje krok vzorkování v jednotkách pikosekund. Je tedy podobný vlastnostmi konstrukci popsané v této práci. Nevýhodou je však to, že autoři se příliš nezabývali generátorem impulzů, náběžná hrana použitého generátoru činí přibližně 2 ns. Důvod, proč tak autoři učinili, je možná omezení vyplývající ze zvoleného způsobu vzorkování pomocí komparátoru a digitálního integrátoru.

Zapojení hodinového generátoru s fázovým závěsem Si5351 je zobrazeno na 3.3. Symbol obvodu je rozdělený na dvě části, U207A a U207B. Kromě samotného obvodu Si5351 je potřeba pouze referenční krystal a napájecí obvody. Napájení je rozděleno na dvě domény. První je jádro fázového závěsu, které napájí interní logické obvody a VCO. Druhá napájí výstupní budiče. Toto rozdělení by mělo omezit fázový šum generovaných hodinových signálů způsobený rušením na napájení VCO [Sil15]. Pro krystalový oscilátor není potřeba používat zatěžovací kondenzátory, jsou obsaženy uvnitř obvodu Si5351, je možné je nastavit v rozsahu 4 pF–10 pF.

Výstupní budiče obvodu Si5351 jsou slučitelné jak s CMOS obvody a jejich modernějšími variantami, tak i s obvody rodin TTL, ECL, CML, LVDS a podobnými. Budiče jsou proudové, proud je možné nastavit ve čtyřech krocích v rozsahu 2 mA–8 mA [Sil18]. Tohoto faktu je využito v zapojení, 4 výstupy jsou použity přímo pro proudové buzení vzorkovacích můstků, 2 výstupy pro



Obrázek 3.3: Zapojení hodinového generátoru Si5351.

buzení CML bufferu, jeden výstup pro synchronizaci vzorkování použitého mikrokontroleru a jeden výstup pro řízení stavu CML bufferu.

Dle katalogových údajů by tento fázový závěs měl typicky dosahovat mezivrcholového fázového šumu 70 ps, maximálně 155 ps. Dle výrobce by mělo jít o parametry v „nejhorším možném případě v reálné aplikaci ... skutečné vlastnosti mohou být výrazně lepší“ [Sil18]. Bohužel není uvedeno, jak se tento parametr mění v závislosti na nastavení násobících a dělicích sekcí. Není uveden ani histogram šumu, jeho frekvenční spektrum, ani efektivní hodnota. Spektrum fázového šumu je možné najít v [JMN14], bohužel se nejedná o ověřený zdroj.

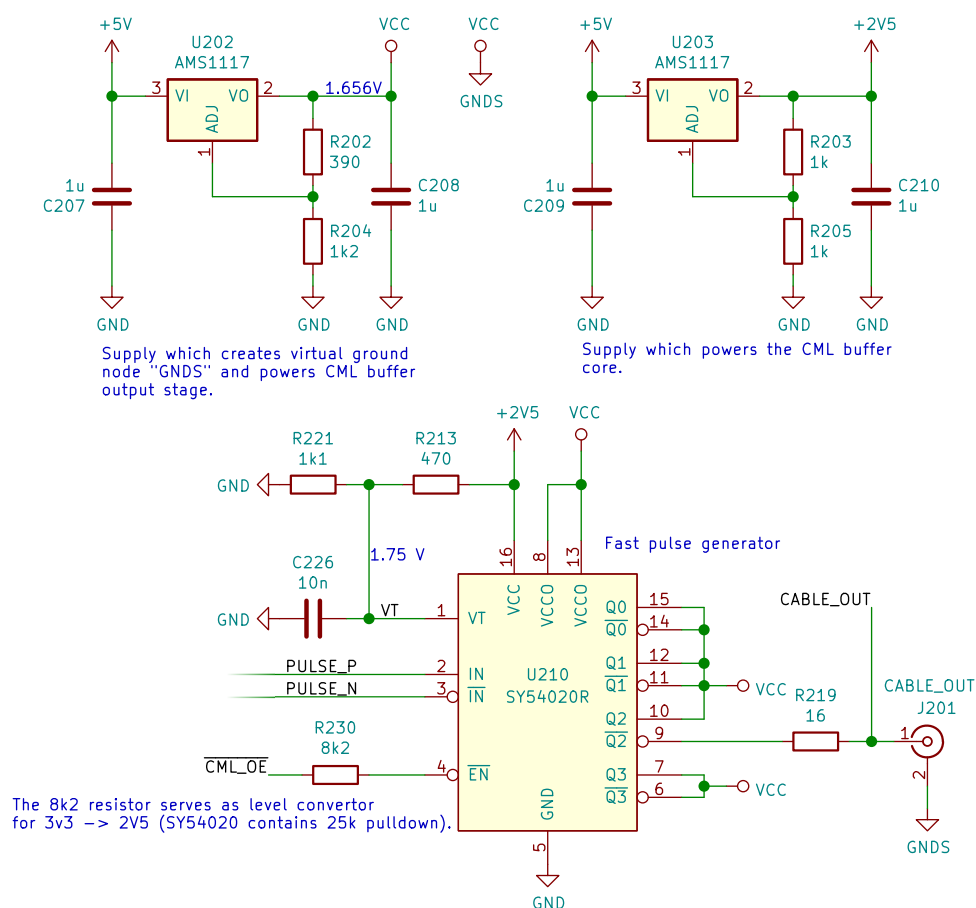
3.4 Tvorba budicího pulzu

Pro tvorbu budících pulzů byl vybrán obvod SY54020, který je původně určen jako CML buffer. Logické obvody CML používají logické úrovně referencované vůči kladnému pólu napájení, výstupy i vstupy těchto obvodů jsou přizpůsobené impedanci 50 Ω. Podle katalogových údajů [Mic09] by měla výstupní

impedance ležet v rozsahu $45\ \Omega$ – $55\ \Omega$. Hlavní důvod pro použití tohoto bufferu je vysoká rychlost, dle katalogových údajů by měla délka náběžných a sestupných hran spadat do rozsahu 35 ps–100 ps, typicky 60 ps. Tento údaj je udáván pro body, kde prochází náběžná hrana 20 % a 80 % mezi původním a konečným napětím. U obvodu Si5351 by podle katalogových údajů měl tento parametr být typicky 1 ns, maximálně 1,5 ns. Použitím obvodu SY54020 by tedy mělo být možné zkrátit náběžné hrany o 90 %–98 % oproti přímému použití výstupu z obvodu Si5351 jako zdroje budících pulzů.

Postatná výhoda obvodu SY54020 spočívá v oddělení napájecích úrovní vstupů a výstupů tohoto obvodu. V zapojení je vstupní část obvodu napájena 3,3 V, výstupní část 1,65 V, tedy přesně polovičním napájecím napětím. Tato napájecí hladina označená jako VCC, a zároveň jako GNDS, je použita jako virtuální analogová země. Všechny následující obvody jsou vztaženy k této virtuální zemi.

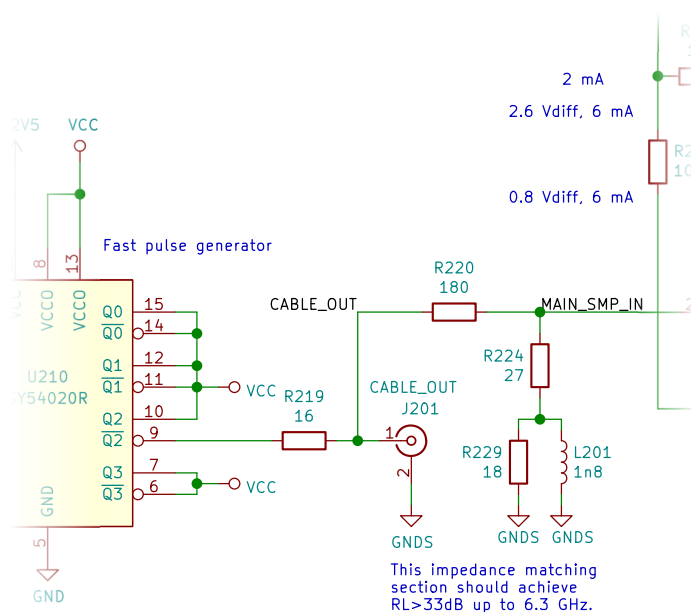
Zapojení generátoru budících impulsů je na obrázku 3.4.



Obrázek 3.4: Zapojení generátoru budících pulzů

3.5 Přizpůsobovací obvody a testovací port

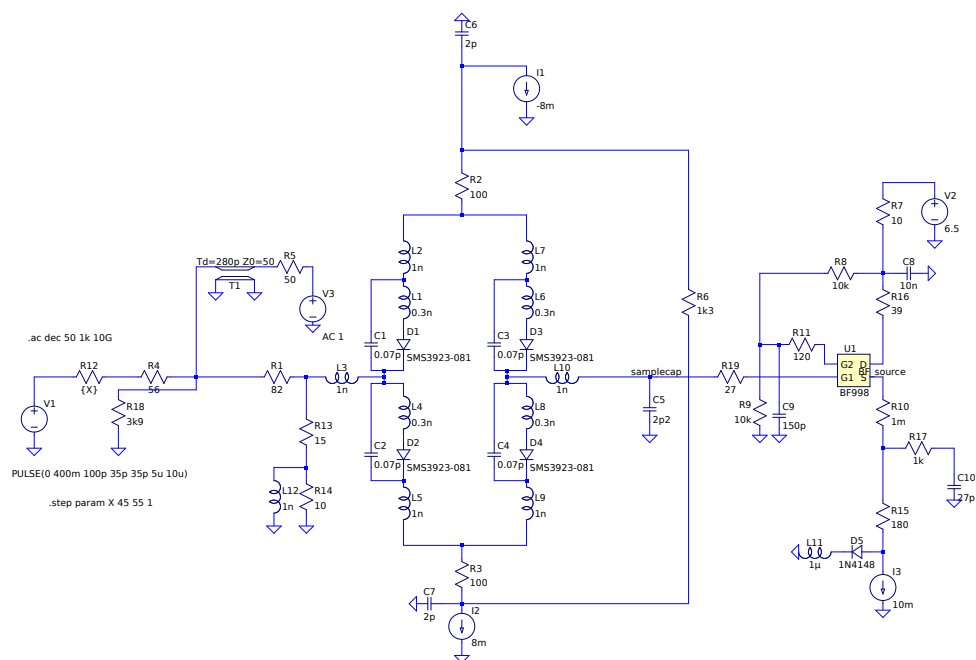
Generátor budících impulsů z předchozího bodu je nezbytné připojit k měřicímu portu. K tomuto portu však musí být zároveň připojeny vzorkovací obvody. Proto jsou nezbytné přizpůsobovací obvody, které umožňují připojit k testovacímu portu obě tyto části při dodržení vstupní impedance. Jejich zapojení je uvedeno na obrázku 3.5.



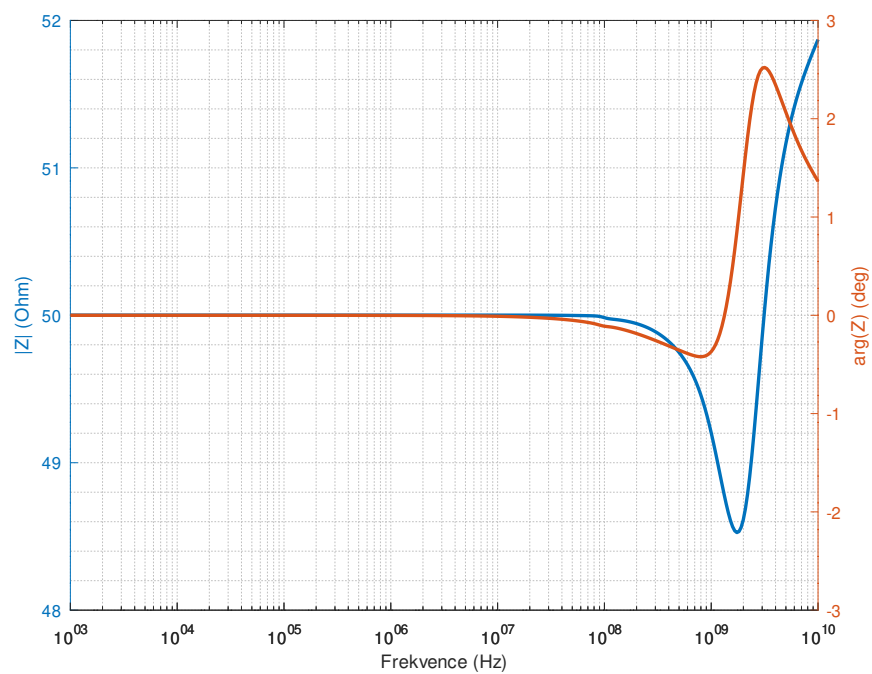
Obrázek 3.5: Schéma přizpůsobovacích obvodů.

Přizpůsobovací obvody jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího impedančního přizpůsobení na testovacím konektoru. Problematická je impedance vzorkovacího můstku, neboť na jeho výstupu je připojen vzorkovací kondenzátor, který způsobuje rezonanci pouzdra vzorkovacího můstku na frekvenci přibližně 1.7 GHz.

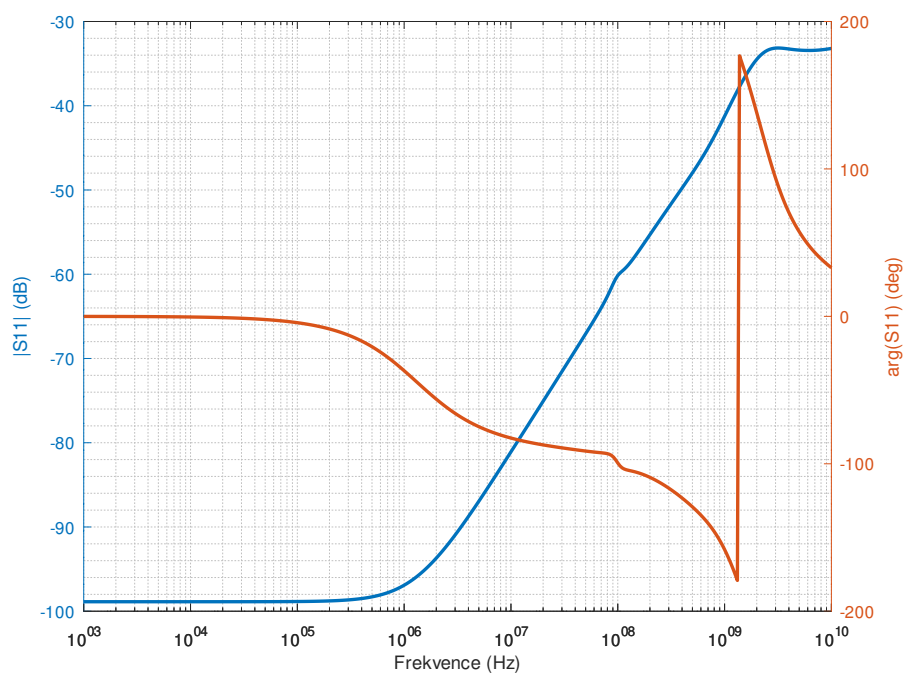
3. Princip zapojení



Obrázek 3.6: Schéma použité pro simulaci v programu LTSpice.



Obrázek 3.7: Vstupní impedance reflektometru.



Obrázek 3.8: Přizpůsobení vstupní impedance reflektometru.

■ 3.6 Vzorkovací obvody

■ 3.7 Oddělovací zesilovač

■ 3.8 Sekundární vzorkování

■ 3.9 Digitalizace měřeného průběhu

Kapitola 4

Kalibrace

4.1 Chybový model

4.2 Chyby pramenící z nepřesnosti frekvence fázového závěsu

4.3 Měření parametrů chybového modelu

4.4 Kompenzace chyb

4.5 Omezení plynoucí z omezené šířky pásma zapojení

Změřenou odezvu $y(t)$ je nezbytné dále zpracovávat. Uvedená impulzní odezva je zatížena několika různými zdroji chyb. Prvním zdrojem chyb je samotný budicí pulz, jenž není ideální a je nezbytné nejprve provést kalibrační měření pro odstranění tohoto zdroje chyb. Jednou z možností, jak odstranit tento zdroj chyb, je změřit ideálně zakončený testovací port. Pro tento typ zakončení by mělo platit, že nedochází k žádným odrazům, a tedy by pro impulzní odezvu takového kalibračního standardu mělo platit následující tvrzení.

$$h(t) = \begin{cases} 1 & t = 0; \\ 0 & t \neq 0; \end{cases} \quad (4.1)$$

Pak platí tedy, že:

$$y(t) = x(t). \quad (4.2)$$

Takto je možné zjistit podobu budicího pulzu. Takováto metoda kalibrace však pokrývá jen jeden zdroj chyb. Mezi další zdroje chyb





Pomocí kalibračních metod je možné data získaná jako odezvu na tento budicí signál transformovat do podoby, která je vhodnější pro další zpracování. Pro plné odstranění vlivu průběhu budicího signálu na odezvě je vhodné měřenou odezvu transformovat do podoby impulzní nebo skokové odezvy. Tuto korekci měřených dat je možné provést buď v časové oblasti např. Wienerovou dekonvolucí nebo ve frekvenční oblasti. Pouhá korekce do podoby impulzní odezvy je však nedostačující pro korekci měřených dat, neboť Kalibrací je možné také zároveň odstranit vliv nedokonalostí reflektometru a připojeného vedení, např. přeslechy, útlum vedení a odrazy na konektorech [RR08].

Z této impulzní odezvy je možné nadále analyzovat měřený systém. V případě reflektometrie je typicky požadován jako výstup měření impedanční profil měřeného systému.



Kapitola 5

Detekce závad

-  5.1 Princip hledání závad
-  5.2 Základní typy závad
-  5.3 Složené závady
-  5.4 Výpočet impedančního profilu

Kapitola 6

Změřené parametry

6.1 Budicí pulz

6.1.1 Průběh budicího pulzu

6.1.2 Spektrum budicího pulzu

6.2 Parametry fázového závěsu

6.2.1 Jitter fázového závěsu v celočíselném režimu

Histogram jitteru

Frekvenční spektrum jitteru

Chování jitteru při průměrování

6.2.2 Jitter fázového závěsu v racionálním režimu

Histogram jitteru

Frekvenční spektrum jitteru

Chování jitteru při průměrování

6.2.3 Drift fázového závěsu



Kapitola 7

Uživatelské rozhraní a popis ovládání

■ 7.1 Chování zařízení v autonomním režimu

■ 7.1.1 Autokalibrace

■ Kalibrace polohy budicího pulzu

■ Kalibrace polohy měřicí roviny

■ Kalibrace vzorkovacího kmitočtu

■ 7.1.2 Kalibrace pomocí kalibračních standardů

■ 7.1.3 Měření

■ 7.1.4 Vyhodnocení změřených dat

■ 7.2 Chování zařízení v režimu s připojeným počítačem

■ 7.2.1 Autokalibrace

■ 7.2.2 Kalibrace pomocí kalibračních standardů

■ 7.2.3 Měření

■ 7.2.4 Vyhodnocení změřených dat



Kapitola 8

Závěr

Příloha A

Literatura

- [CF05] Chet Lo and C. Furse, *Noise-domain reflectometry for locating wiring faults*, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility **47** (2005), no. 1, 97–104.
- [DJJ03] Donghwan Lee, Jinho Sung, and Jaehong Park, *A 16 ps-resolution Random Equivalent Sampling circuit for TDR utilizing a Vernier time delay generation*, 2003 IEEE Nuclear Science Symposium. Conference Record (IEEE Cat. No.03CH37515), vol. 2, Oct 2003, pp. 1219–1223 Vol.2.
- [GLR07] Mohammad Ghavami, Michael Lachlan, and Kohno Ryuji, *Ultra Wideband Signals and Systems in Communications Engineering*, 2nd ed., John Wiley and sons, 2007 (English).
- [JMN14] John Miles (KE5FX) Jason Mildrum (NT7S), *Si5351 Investigations Part 7*, 11 2014, <https://nt7s.com/2014/11/si5351a-investigations-part-7/>.
- [Mic09] Micrel, Inc., San Jose, *SY54020AR datasheet*, 4 2009.
- [MP74] N. A. M. Mackay and S. R. Penstone, *A High-Sensitivity Narrow-Band Time-Domain Reflectometer*, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement **23** (1974), no. 2, 155–158.
- [RR08] A. Rumiantsev and N. Ridler, *Vna calibration*, IEEE Microwave Magazine **9** (2008), no. 3, 86–99.
- [Sar97] Philip E Sarachik, *Principles of linear systems*, Cambridge University Press, 1997.
- [Sil15] Silicon Laboratories Inc., Austin, *AN619: Manually Generating an Si5351 Register Map*, 2015.
- [Sil18] Silicon Laboratories Inc., Austin, *Si5351 datasheet*, 2018.
- [Tek85] Tektronix, Inc., Beaverton, Oregon, *S-4 Sampling Head Instruction Manual*, 3 1985.

- [TKF⁺13] D. Trebbels, A. Kern, F. Fellhauer, C. Huebner, and R. Zengerle, *Miniaturized FPGA-Based High-Resolution Time-Domain Reflectometer*, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement **62** (2013), no. 7, 2101–2113.